®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平2-37655

Solnt. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月7日

H 01 J 37/305 H 01 L 21/027

7013-5C

H 01 L 21/30 8831-5F 7376-5F

3 4 1 3 5 1 В

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称

リングラフィ装置用制御板の製造方法

②特 頭 平1-137321

題 平1(1989)5月29日

優先権主張

図1988年5月31日 図西ドイツ(DE) 3P3818535.0

ウオルフガング、ベネ 個発 明者

ドイツ連邦共和国ベルリン30、ジギスムントシュトラーセ

伽発 明 者 ウベ、シユナーケンベ ドイツ連邦共和国ベルリン21、ピルケンシュトラーセ10

ルク

個発 ブルクハルト、リシユ ドイツ連邦共和国ミユンヘン82、インデアホイルス13

顧 シーメンス、アクチエ 创出

ドイツ連邦共和国ベルリン及ミユンヘン(番地なし)

ンゲゼルシヤフト

四代 理 人 弁理士 富村

- 1. 発明の名称 リソグラフィ装置用制御板の 製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1) 多数の粒子プローブ (14、14.1) で付 勢される制御板が、粒子プローブ (14、1 4°)を過すための切欠部(10)を備えた 半導体層(2)及び粒子プローブ(14、1 4 1)の数と一致する数の偏向素子(9、91) を有する形式のリソグラフィ装置用の制御板 を製造する方法において、

半導体基板(1)の表面に第1誘電層(2) をまたその背面に第2誘電商(3)を設け、 金属層(4)を第1號電層(2)上に折出

第2誘電商(3)を半導体基板(1)に製 造すべきスルーホール(10)の寸法に相応 して構造化し、

製造すべき傷向素子(9、9′)の寸法及 び配置を金属層(4)上に施されたフォトレ

ジスト篇(8)上にリソグラフィで転写し、そ の際フォトレジスト層(8)の厚さが偏向素 子(9)の高さを上回るようにし、

フォトレジスト層(8)中に作られた凹部 を傾向業子(9)の所望の高さまで電着によ りったし、

フォトレジスト庫 (8)を除去し、

半導体基板(1)の背面をエッチング処理 することによりスルーホール(10)を形成

スルーホール(10)の範囲内の金属層(4) 及び銀1誘電層 (2) をエッチング処理 により除去する

ことを特徴とするリソグラフィ装置用制御板 の製造方法。

2) 多数の粒子プロープ (14、14')で付 勢される制御板が、粒子プローブ(14、1 4 ′)を通すための切欠部(10)を備えた 半導体層(2)及び粒子プローブ(14、1 - 4 *)の数と一致する数の偏向素子(9、9 *)

特開平2-37655(2)

を有する形式のリングラフィ装置用の制御板 を製造する方法において、

半導体基板(1)の表面に第1核電層(2) をまたその背面に第2核電腦(3)を設け、

金属層(4)を第1技電層(2)上に折出させ、

第2誘電層(3)を半導体基板(1)に製造すべきスルーホール(10)の寸法に相応 して構造化し、

会議層を第1中間層(11)及び第2中間 層(12)で覆い、その際第1中間層(11) の厚さが形成すべき場向素子(9)の高さを 上回るようにし、

製造すべき傷向素子 (9) の寸法及び形状 を第2中間度 (12) 上に施されたフォトレ ジスト層 (5) 上にリソグラフィにより転写

フォトレジスト層 (5) の精造をエッチング処理により第 I 及び第 2 中間層 (1 1 、 1 2) に転写し、

御板が、粒子プローブを通すための切欠部を備えた半導体層(ダイアフラム)及び粒子プローブの数と一致する数の偏向素子を有する形式の、リソグラフィ装置用の制御板を製造する方法に関する。 (世来の技術)

米国特許第4724328号明細書からリソグ
ラフィ装置(電子ピーム記録器)は公知であり、
その電子光学柱状体は多数の個々に偏向可能の電子プローブを得るための閉口絞りを有する。欧州
特許出願公開第191439号明細書に詳述されている開口絞りは主として列状の多穿孔構造を有するシリコンのダイアフラムからなり、その表面には偏向単位として作用する電極系が配置されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明の課題は、多数の粒子プロープで付勢される制御板が半導体層及び粒子プローブの数に相応する数の偏向素子を有する形式の、リソグラフィ装置用の制御板を製造する方法を提供することにある。

第1中間層(11)中に形成された凹部を、 偏向素子(9)の高さまで電着により構たし、 フォトレジスト層(6)及び中間層(11、 12)を除去し、

スルーホール (10) を半導体基板の異方 性エッチングによりウエハの背面に形成し、

スルーホール(10)の範囲内の第1誘電 腐(2)と金属層(4)をエッチング処理に より除去する

ことを特徴とするリソグラフィ装置用制御板 の製造方法。

- 3) 半導体基板(1)がシリコンからなり、このシリコンが(1,0,0)配向を有することを特徴とする請求項1又は2記載の方法。
- 4) 半導体基板(1)がシリコンからなり、このシリコンが(1, 1, 0)配向を有することを特徴とする請求項1又は2記載の方法。

.3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、多数の粒子プローブで付勢される制

(課題を解決するための手段)

この課題は本発明によれば特許請求の範囲の請求項1及び2に記載した方法によって解決される。 請求項3及び4は本発明方法の有利な実施態機を 示すものである。

(発明の効果)

本発明により得ることのできる利点は特に、本 免明方法により製造された偏向素子がマイクロエ レクトロニクス分野で通常に用いられる制御電圧 で付勢され得ることである。

(実施例)

次に本発明を図面に基づき辞述する。

第1図に略示した制御板は主として、多放射源から発せられる粒子プローブ14、14 を過ずための窓10及び相応する数の偏向素子9、9 (これはポンド・パッド7、7 及び接続導体を介して、電子又はイオンピームリングラフィ塩電の制御信号発生エレクトロニクスに接続されている)を備えた単結晶半導体基板1からなる。多放射激としては特に、制御板の上方に配置されかつ

特開平2-37655(3)

大表面の一次粒子ピームで付勢される、切欠部を 有する絞りが考慮される。粒子プローブ14、1 4. の各々には制御板の偏向素子9、9. が所属 し、これによりその都度の粒子プローブ14、1 4 を個別に偏向し、場合によっては帰線消去す ることができる(当該粒子プローブを光線路内で 制御板の下方に配置された絞りに偏向させる)。 偏向素子9、9、及び場合によっては強化された ポンド・パッドフ、で、を製造しまた誘電体2で 被覆された半導体基板1に接続させるには、リソ グラフィ法及び電響成形技術を使用することが好 ましく、この場合リソグラフィは製造すべき構造 体の寸法及び形状との関連においてUV又はシン クロトロン光線で実施する。偏向素子9、9′の 高さは、数10μα、特に10~100μαであ り、従ってマイクロエレクトロニクスでの通常の 制御電圧で加工することができる。

第1図に示した制御板を製造する方法は本発明 においては次の処理工程を含む(第2図参照)。

- 半導体基板1例えば(1,0,0)又は(1,

1. 0)配向を有するシリコン上への、第1 35 電暦 2 例えば窓化珪素又は酸化珪素層の折出 (第2 図a、 b)、

- 基板下面への第2誘電層3、例えば窒化珪素 又は酸化珪素の折出(第2図b)、
- 試電暦2への、金属製電気めっき出発層4、 例えばクロム・金又はチタン・金層の折出(第 2図c)、
- 誘電層3に遠心墜布されたフォトレジスト層6への、蒸板スルーホール10の寸法のリソクラフィ転写、及び誘電層3のエッチング(構造化)(類2図d、e)、
- 一 電気めっき出発層4に遠心塗布されたフォトレジスト層5への、接続導体及びボンド・パッド7、7 の寸法及び形状のリソグラフ4 転写(第2図d)、
- 接続導体7の電気めっき補強及びフォトレジスト層5の除去(第2回c、()、
- フォトレジスト層8でのウェハ表面の被覆(その厚さは形成すべき偏向素子9の所望の高さ

よりも大きい)(第2図g)、

- フォトレジスト階8への、偏向素子9の寸法 及び形状のリソグラフィ転写(第2図1)、
- フェトレジスト暦 8 に製造された凹部の、偏向素子 9 の所望の高さまでの電気めっきによる 充域(第 2 図 h)、
- フォトレジスト層8の除去(第2図i)、
- 基板スルーホール 10を得るための、ウエハ ・背面での半導体基板 1の温式化学的異方性エッチング(第2図 1)、
- スルーホール10の範囲内での誘電層2及び電気めっき出発層4のエッチング(第2図))。本発明の別の方法によれば、偏向素子9は三層技術を使用することによっても製造することができる。この処理は第3回に基づき説明する工程を含み、この場合には第2図1に示した構造体から出発する。
- ~ レジスト又はプラスチック11(例えばポリイミド)でのウェハ表面の被覆(この厚さは、これが形成すべき偏向素子9の高さを上回るよ

うに構成する) (第3図a、b)、

- 第2中間暦12、例えば窒化・アルミニウム 又は珪素の塗布(第3図b)、
- 中間隠12上に遠心懐布されたフォトレジスト層5への、偏向素子9の寸法及び形状のリソグラフィ転写(第3図b、c)、
- 中間隔11及び12のエッチング(構造化) (第3図d)、
- 第1中間暦11内に製造された凹部の、偏向素子9の所望の高さまでの電気めっきによる充域(第3図e)、
- つまトレジスト層 5 及び中間層 1 1 及び 1 2の除去(第3図1)、
- スルーホール10を得るための、ウェハ背面での基板1の温式化学的異方性エッチング(第3図g)、
- スルーホール10の範囲内での誘電層2及び 電気めっき出発層4のエッチング(第3図8)。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は製造すべき制御板の略示図、第2図及

特開平2-37655(4)

び第3図は制御板を製造するための処理工程図で

ある.

1…半導体基板

2、3…抗電用

4 … 金属層

5、6…フォトレジスト層

7、7 ~ …ポンド・パッド

8 … フォトレジスト層

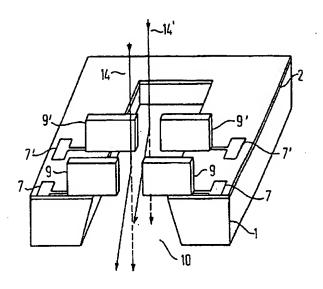
9、9 "…偏向素子

10…スルーホール

11、12…中間層

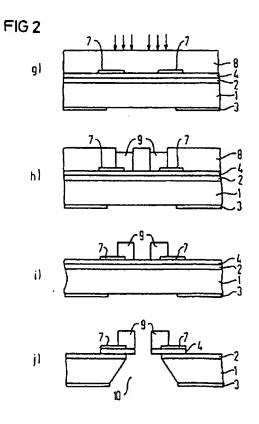
14、14 ~…粒子プローブ

FIG 1



(8118) 代用人 赤斑土 富村

7



特開平2-37655(5)

